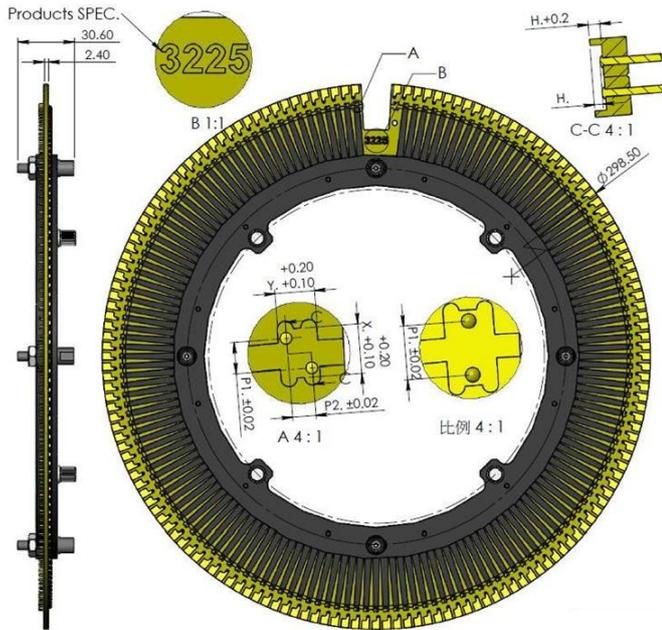
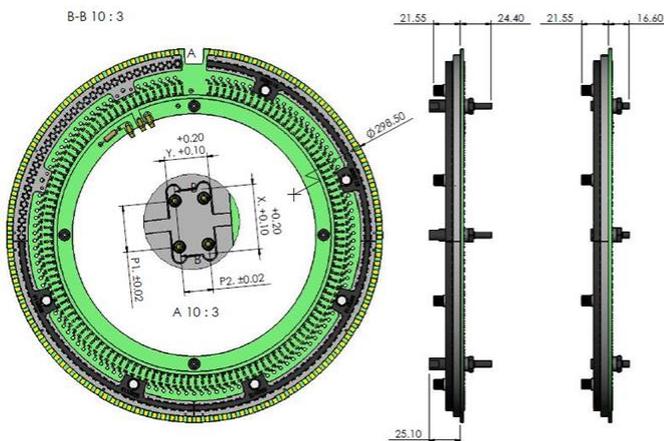
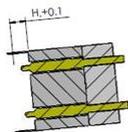


# 温度系统 SMD 晶体/钟振测试碟系列



Ordering code	PKG dimension(mm)		Test center(mm)		Height	Pin No.	晶片直径 / 晶片	PKG 类
	X	Y	P1	P2				
X1-105085029-066054	1.05	0.85	0.66	0.54	0.24	X9-025	d=0.6mm/ t=1mm	X
X1-1210-075060	1.2	1	0.75	0.60	0.3	X9-025	d=0.6mm	X
X1-125105-075060	1.25	1.05	0.75	0.60	0.34	X9-025	d=0.6mm	X
X1-125105-084070	1.25	1.05	0.84	0.70	0.55max	X9-025	d=0.6mm	X
X1-125105-086070	1.25	1.05	0.86	0.70	0.55max	X9-025	d=0.6mm	X
X1-1610-1007	1.6	1	1.06	---	0.45	X9-015G	d=0.6mm	O
X1-1612-1007	1.6	1.2	0.98	0.68	0.3	X9-015G	d=0.6mm	O
X1-165105-11	1.65	1.05	1.11	---	0.3	X9-015G	d=0.6mm	O
X1-165125056-1308	1.65	1.25	1.30	0.80	0.56	X9-015G	d=0.6mm	O
X1-165125-1007	1.65	1.25	1.00	0.70	0.3	X9-015G	d=0.6mm	O
X1-2012-13	2	1.2	1.30	---	0.45	X9-015G	d=0.6mm	O
X1-205125-1407	2.05	1.25	1.40	0.72	0.35	X9-015G	d=0.6mm	O
X1-205165-209	2	1.6	1.24	0.97	0.5	X9-015G	d=0.6mm	O
X1-205165-1310	2.05	1.65	1.28	0.98	0.45	X9-015G	d=0.6mm	O
X1-205165-1511	2.05	1.65	1.50	1.10	0.5	X9-015G	d=0.6mm	O
X1-205165-1610	2.05	1.65	1.64	1.03	0.5	X9-015G	d=0.6mm	O
X1-2520-1612	2.5	2	1.66	1.20	0.5	X9-021C	d=1.2mm	O
X1-2520-1912	2.5	2	1.90	1.20	0.7	X9-021C	d=1.2mm	O
X1-3215-23	3.2	1.5	2.35	---	0.65	X9-021C	d=1.2mm	O
X1-3225-21	3.2	2.5	2.10	---	0.5	X9-021C	d=1.2mm	O
X1-3225-2116	3.2	2.5	2.15	1.60	0.6	X9-021C	d=1.2mm	O
X1-3225-11	3.2	2.5	1.10	---	0.95	X9-021C	d=1.2mm	O
X1-4025-3116	4	2.5	3.10	1.60	0.7	X9-021C	d=1.2mm	O
X1-4115-33	4.1	1.5	3.30	---	0.5	X9-021C	d=1.2mm	O
X1-5032-2522	5	3.2	2.54	2.20	0.9	X9-021C	d=1.2mm	O
X1-5032-3723	5	3.2	3.70	2.30	0.9	X9-021C	d=1.2mm	O
X1-5032-16	5	3.2	1.60	---	1.2	X9-021C	d=1.2mm	O
X1-5032-37	5	3.2	3.70	---	1.1	X9-021C	d=1.2mm	O
X1-6035-4424	6	3.5	4.40	2.40	0.95	X9-021C	d=1.2mm	O
X1-6035-44	6	3.5	4.40	---	1	X9-021C	d=1.2mm	O
X1-48S	12	4.8	4.88	---	3	X9-021C	d=1.2mm	O
X2-7050-5625	7	5	5.60	2.54	1	X9-021C	d=1.2mm	O
X2-7050-56	7	5	5.60	---	1	X9-021C	d=1.2mm	O
X2-7349-5625	7.3	4.9	5.60	2.50	1.1	X9-021C	d=1.2mm	O
X2-8045-66	8	4.5	6.60	---	1.2	X9-021C	d=1.2mm	O

- X1: 160 位晶体温度测试碟
- X2: 140 位晶体温度测试碟
- 专用校准电阻套件,自动进行校准,方便易用(配 KH7700 温测系统)
- 其它品种,请与科研联络



Ordering code	PKG		Height		Test	
	X	Y	H	P1	P2	
X4(1)-161204-1007	1.65	1.25	0.4	0.98	0.68	
X4(1)-201607-1209	2	1.6	0.7	1.24	0.97	
X4(1)-252008-1612	2.5	2	0.8	1.65	1.25	
X4(1)-2520085-1612	2.5	2	0.85	1.65	1.25	
X4(1)-252008-207125	2.5	2	0.8	2.07	1.25	
X4(1)-252009-1612	2.5	2	0.9	1.65	1.25	
X4(1)-322509-2518	3.2	2.5	0.9	2.5	1.8	
X4(1)-322509-2116	3.2	2.5	0.9	2.15	1.6	
X4(1)-322509-2516	3.2	2.5	0.9	2.5	1.6	
X4(1)-322511-2116	3.2	2.5	1.1	2.15	1.6	
X4(1)-322516-2617	3.2	2.5	1.6	2.6	1.7	
X4(1)-503210-2522	5	3.2	1	2.54	2.2	
X4(1)-503210-3723	5	3.2	1	3.7	2.3	
X4(1)-503211-2522-6P	5	3.2	1.1	2.54	2.2	
X4(1)-5032115-3723	5	3.2	1.15	3.7	2.3	
X4(1)-503212-2522	5	3.2	1.2	2.54	2.2	
X4(1)-705013-5038	7	5	1.3	5.08	3.8	
X4(1)-705014-5038	7	5	1.4	5.08	3.8	
X4(1)-734810-5036	7.3	4.8	1	5.08	3.6	
X4(1)-755013-5038	7.5	5	1.3	5.08	3.8	
X4(1)-7551195-5038	7.5	5.1	1.95	5.08	3.8	
X42-705013-5038-6P	7	5	1.3	5.08	3.8	

- X4: 128 位钟振温度测试碟 -- 两层配套
- X41: 128 位钟振温度测试碟 -- 四层配套
- 其它品种,请与科研联络

该技术指标只为本版本情况,日后升级不会另行通知  
所附图片仅供参考



科研精密科技有限公司 科研集团

总部:香港荃湾柴湾角街 84-92 号顺丰工业中心 24 字楼 C 座 电话: (852) 35112388 传真: (852) 35112300

科研自动化设备(惠州)有限公司

广东省惠州市惠城区高新科技产业园三栋中心园泰祥路 A-02 号 ZIP 516025 电话(86) 0752 5704969/传真 5707901

Email: kolinker@kolinker.com

<https://www.kolinker.com>

